

مجله پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۰، شماره ۴، زمستان ۸۹

/

ardyanian@du.ac.ir :

(دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۷/۴ ؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۸۹/۹/۳۰)

۱۰۰°C	SiO	GeO	(1 < x < 2) GeO <sub>x</sub> / SiO <sub>y</sub>
(TEM)	(FTIR)		(XPS)
۹۰۰°C	GeO <sub>x</sub>		
eV		۴۰۰°C	
(FWHM)		GeO <sub>x</sub>	SiO
			GeO <sub>x</sub>

:

مقاله کامل در جلد انگلیسی مجله با همین شماره به چاپ رسیده است.